

GDS Snapshot ステンレス上の酸化薄膜



分析条件

装置	LECO GDS850A
分析元素	C, Cr, Fe, Ni, O, Mn, Mo, Ca
ランプ	Grimm-style RF 4mm ランプ
オペレーティング条件	30W, 1000V
プロファイリング時間	<5s, 1000/s
サンプル	ステンレス

分析例

GDS850 による測定の結果、研磨されたステンレス表面の薄膜は 3nm 以下であることが分かる。

